

## عنوان مقاله:

تحلیل حساسیت یونیزاسیون برخوردی حامل الکتریکی با شبکه پرسپترون چند لایه

## محل انتشار:

چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

## نویسندگان:

ایران سلطانی نوری - دانشجوی کارشناسی ارشد - دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی وا

محمد سروش - استادیار - دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

## خلاصه مقاله:

در این مقاله ابتدا با استفاده از شبکه پرسپترون چند لایه ظرایب، یونیزاسیون برخوردی الکترون و حفره را محاسبه می کنیم. برای این کار گاف انرژی (E<sub>g</sub>)، جرم مؤثر حامل و میدان الکتریکی را به عنوان ورودی شبکه در نظر می گیریم. ضرایب یونیزاسیون برخوردی الکترون و حفره، خروجی شبکه خواهند بود. با الگوریتم آموزشی trainlm شبکه را آموزش می دهیم تا به کمترین خطای آموزش دست یابیم. پس از ارزیابی درستی کارکرد شبکه، ضرایب یونیزاسیون برخوردی الکترون و حفره را نسبت به هر یک از پارامترها به ازای ثابت ماندن دیگر متغیرها ارزیابی می کنیم.

## کلمات کلیدی:

یونیزاسیون برخوردی، شبکه عصبی پرسپترون چند لایه

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/164355>

